

Relazione motivazione d'acquisto

Il progetto ERC-SELDOM (CUP I41I18000060006) ha la necessità di caratterizzare la rugosità superficiale di campioni in silicio tramite microscopia a forza atomica. Tipicamente, tale tecnica prevede la caratterizzazione di campioni di dimensione contenuta. Diversamente dalle consuetudini, i campioni di interesse sono relativamente voluminosi: trattasi di 4 wafers in silicio di diametro 100 mm e spessore 10 mm, ed un wafer in silicio di spessore 18 mm e diametro 100 mm. Per ogni wafer è necessario effettuare due misure da 30 e 5 microns di lato su tre punti diversi del wafer

Si chiede di affidare la commessa a “PRA.MA strumenti scientifici”, che offre tale servizio al costo di euro 384+IVA.

Quanto acquistato verrà utilizzato esclusivamente nell'ambito del work package 3, denominato "fixed-target setup", del progetto SELDOM (CUP I41I18000060006).

Il proponente

Andrea Mozzolini

Il RUP